# PANI 的内光电发射

黄怀国1 罗 瑾2 张红平2 吴玲玲2 林仲华2

(1. 厦门紫金科技股份有限公司,福建紫金矿冶研究院,福建紫金矿业股份有限公司,上杭 364200;2. 厦门大学固体表面物理化学国家重点实验室,化学系,物理化学研究所,厦门 361005)

摘要 利用电化学方法在自组装一层对氨基硫醇(PATP)的金电极上制备三种氧化还原态的聚苯胺(PANI) 膜. PANI 膜底层比较致密,表面呈山包状,该膜在  $K_{3}Fe(CN) \delta/K_{4}Fe(CN)\delta$  溶液的循环伏安图表明了部分 氧化态 PANI 膜具有良好的电子传输性能.从光电流谱得到氧化态 PANI 的禁带能为 1.45 eV. 首次发现部 分氧化态 PANI 膜的光电流谱遵循 Fowler 定律(IPCE<sup>1/2</sup> ~  $h_{V}$ 呈线性),具有内光电发射的性质.通过 Fowler 图得出部分氧化态 PANI 的绝缘母体的禁带宽度为 3.33 eV,并且证实该绝缘母体为还原态 PANI.从 Mott-Schottky 图得到部分氧化态和还原态 PANI 的平带电位都为 0.63 V(vs. SCE).提出了和 PANI 的颗粒金属 岛导电模型一致的内光电发射机理来解释部分氧化态 PANI 的光电化学过程.

关键词 聚苯胺;光电化学;内光电发射

中图分类号 0.646 文献标识码 A 文章编号 0.251-0790(2002)03-0432-05

PANI,作为一种杂环导电聚合物,因为其具有特殊电子导电性、电子结构<sup>1~5]</sup>及电子导电机  $\mathbb{P}^{[6^{-11]}}$ 而引起了广泛的重视.在酸溶液中,PANI的电化学掺杂可导致导体至绝缘体的转变<sup>[12~14]</sup>.在 1.0 mol/L 的高氯酸水溶液中,PANI的循环伏安图出现了两对氧化还原峰,其相应的半波电位  $E^{12}$ 分别约为 0.13 V 和 0.7 V(对饱和甘汞电极):电位较负的峰对应着还原态和部分氧化态 PANI的氧化还 原,电位较正的峰对应着部分氧化态和氧化态 PANI 的氧化还原.通常人们认为还原态 PANI 价带和导带分别由  $\pi^*$ 和  $\pi$ 轨道组成,禁带宽度约3~4 eV<sup>[1,5]</sup>.部分氧化态 PANI 禁带中存在半充满的极化子能带,费米能级通过极化子能带<sup>[2,5]</sup>.氧化态 PANI 的导带和价带主要分别来源于 N 一醌一 N 和芳香 环,具有本征半导体结构,禁带宽度约 1.4 eV<sup>[4]</sup>.还原态和氧化态 PANI 为绝缘体,部分氧化态 PANI 则由于其禁带中具有一个半充满的金属极化子能带而表现出金属导电性.大量物理实验证实了部分氧化态 PANI 的颗粒金属岛导电模型.该模型认为在聚合物绝缘母体中存在来源于金属极化子晶格的三维金属岛.金属岛之间的电荷传导受控于荷电能限制的隧道效应<sup>[6~11]</sup>.近年来利用光电化学对 PANI 的光电化学性质和掺杂状态进行研究的报道很多<sup>[15-22]</sup>.许多研究者也已经得到 PANI 的暂态光电化学响应,但是还没有直接测量 PANI 的光电流谱的报道.

众所周知, 许多表面覆盖半导体或绝缘体金属氧化物薄膜的金属体系具有内光电发射效应<sup>[23~25]</sup>. 若认为 PANI 的颗粒金属岛导电模型是合理的, 那么部分氧化态 PANI 与这些金属体系类似, 也应当 具有内光电发射效应.

本文通过对 PANI 进行电化学测量,形貌表征,平带电位测定和光电化学实验,发现所测量的部 分氧化态 PANI 光电流谱遵循通常用来解释内光电发射的 Fowler 定律<sup>[26]</sup>,由此提出 PANI 的内光电 发射模型来解释 PANI 的光电化学过程和相应的能带结构.

1 实验部分

#### 1.1 PANI 膜的制备

为了增强 PANI 的附着力,我们在金表面自组装上一层对氨基硫醇(PATP). Au/PATP 膜制备方

收稿日期: 2000-03-22.

法参考文献[27]. Au/PATP/PANI 膜的制备以 Au/PATP 膜为基底(金电极表观面积约 0.41 cm<sup>2</sup>), 在 0.5 mol/L 苯胺/ 0.5 mol/L HClO<sub>4</sub> 溶液中,利用循环伏安法,电位-0.2~+0.7V (本文后面涉及电 位除非特别说明,均对饱和甘汞电极),扫速 100 mV/s,扫描 100 次而得,膜厚约0.05 mm,且具有相 当好的附着力,在超声波中振动 30 min 仍不会脱落.所得 Au/PATP/PANI 膜置于 1.0 mol/L HClO<sub>4</sub> 溶液中分别在-0.4, +0.35 和+1.00 V 电位下恒电位 10 min,得到相应的还原态,部分氧化态和氧 化态 Au/PATP/PANI 膜.

1.2 仪器及条件

采用 CHI-660 型综合测试仪进行电化学实验;采用日本 HIT A CHI 公司 S-520 扫描电子显微镜进 行形貌观察;光电化学实验利用我们自行设计的测量系统进行<sup>[28]</sup>.测量光电流-电位关系时采用氙灯 光源直接照射电极,实验中所测的光电流均不包含暗态电流.

### 2 结果与讨论

图 1 是三种氧化还原态 PANI 膜和裸金电极在 0.05 mol/L K<sub>3</sub>Fe(CN) <sub>6</sub>/K<sub>4</sub>Fe(CN) <sub>6</sub> 溶液中的循环 伏安图.除了峰电位较负和峰电流较小些外,部分氧化态 PANI 和裸金的循环伏安曲线相似.由于在 电化学条件下制备的还原态 PANI 仍含有少量部分氧化态 PANI,因此作为绝缘体的还原态 PANI 循 环伏安曲线仍有一不明显的氧化还原峰.光电流谱中同样有这种现象存在.氧化态 PANI 的循环伏安 曲线观察不到电流峰.图 1 表明三种氧化还原态 PANI 只有部分氧化态 PANI 具有良好的电子传输性 能.

由扫描电镜图(图 2) 可见,该 PANI 膜有一定起伏,致密膜上有些山包状 PANI, PANI 结构可能 为线团状.



Fig. 1 Cyclic votammograms of 0. 05 mol/L  $K_3Fe(CN)_6/K_4Fe(CN)_6$  solution for the PANI films and bare gold electrode

Fig. 2 SEM micrograph for Au/PATP/PANI el ectrode

Sweep rate: 50 mV/s.

图 3 是三种氧化还原态 PANI 在没有可嵌入阴离子的 0.05 mol/L K<sub>3</sub>Fe(CN)  $_{6}/$ K<sub>4</sub>Fe(CN)  $_{6}$  溶液中 的光伏曲线. 从图 3 可看出, 三种氧化还原态 PANI 膜均在约低于 0.4 V 电位出现阴极光电流, 在约 高于 0.4 V 出现阳极光电流. 在相同电位下, 还原态 PANI 膜比氧化态 PANI 膜光电流稍大, 而部分 氧化态 PANI 膜要比还原态和氧化态 PANI 膜光电流大许多. 部分氧化态 PANI 的光伏曲线正向扫描 和反向扫描有很大不同. 这是因为虽然在 K<sub>3</sub>Fe(CN)  $_{6}/$ K<sub>4</sub>Fe(CN)  $_{6}$  溶液中没有可嵌入离子, 当电位足 够正或足够负时, 部分氧化态 PANI 膜中的 CIO<sub>4</sub> 和 H<sup>+</sup> 离子仍可能脱嵌或嵌入.

从图 4 可看出,在 700 和 0 mV 电位下,还原态和部分氧化态 PANI 膜在能量 1.7~2.8 eV(波长 730~443 nm)范围可分别得到阳极光电流谱和阴极光电流谱,而氧化态 PANI 膜光电流谱出现在 1.45~2.8 eV(波长 855~443 nm)范围.图 4 中光电流转换效率为

433

IPCE=jhc/Nq式中j为光电流密度, h为曾朗克常数, c为光速, R为波长, P为光强, rjg为基本电荷: 可能由于禁带ki.



Fig. 3 The potential dependence of magnitude of photocurrent for PANI films in 0.05 mol/L K3Fe(CN) 6/K4Fe(CN) 6 solution a. Reduced PANI; b. partially-oxidized PANI; c. oxidized PANI.





中缺陷态的捕获,部分氧化态和还原态 PANI 中只能观测到从金属岛中极化子能带跃迁到绝缘母体导带(价带)的电子(空穴)产生的亚带光电流.由于还原态 PANI 仍含有少量部分氧化态 PANI,因此还原态和部分氧化态 PANI 膜的谱带比较相似,但光电转换效率远比部分氧化态 PANI 的低.氧化态 PANI 的光电流谱阈值能为 1.45 eV,与理论计算的  $E_{g}$ 相当一致<sup>[1.4.5]</sup>.我们进一步发现,部分氧化态 PANI 的光电流谱服从 Fowler 定律(见图 5),光电流 Fowler 图的出现表明电子或空穴能够从 PANI 金属岛内光电发射到绝缘母体的合适电子能带.根据从金属内光电发射到半导体的 Fowler 经验公式  $IPCE^{1/2} = A(hv - E_{t})$ 

式中 $E_1$ 为光发射阈值能, h为普朗克常数, v为光子频率, A为常数<sup>[26]</sup>.外推图 5 中直线 a 和 b,得到 阈值能分别为 1.69 和 1.64 eV. 阈值能为电子或空穴相应地从金属岛的费米能级发射到绝缘母体的导 带或价带的最低能量. 由阈值能求得禁带宽度  $E_8$ = 3.33 eV<sup>[24]</sup>(该值比我们的报道<sup>[29]</sup>中的  $E_8$ 大,原因 是本文中谱图经过更合适的平滑处理,求得到  $E_8$ 更可靠),可见金属岛周围覆盖的绝缘体主要为还原 态 PANI.







为了避免法拉第反应的影响,在 1.0 mol/L HClO<sub>4</sub> 溶液(pH= 0.43) 中分别测量部分氧化态和还原态 PANI 阻抗随电位的变化,从而得到他们的 M ott-Schottky 图(图 6). 根据 M ott-Schottky 方程  $1/C^2 = [1.41 \times 10^{20}(E - E_{B} - kT/q)]/\epsilon N$ 

 Mott-Schottky 图斜率为负,表明这两种状态的 PANI 均为 p 型半导体.

从以上实验结果,我们提出了内光电发射的 PANI 光电化学模型:在足够强的光激发下,电子 可以从部分氧化态 PANI 内金属岛的费米能级发射 到绝缘母体的导带,并还原溶液中的电子受体,从 而产生阴极光电流.金属岛的空穴可以发射到绝缘 母体的价带,并氧化溶液中的电子给体,从而产生 阳极光电流.光电流的产生不是由于光诱导下 PANI 产生化学变化引起的.这种模型与目前流行 的 PANI 电子结构和导电机理比较一致.根据光电 流谱和平带电位的测量结果,我们提出了部分氧化



态 PANI 的能带图(图 7). 电位较负, PANI 的  $E_F$  Fig. 7 Energy band diagram of partially-oxidized PANI 上移, 有利于  $Fe(CN)^{3-}$  捕捉光生电子, 从而有利于产生阴极光电流; 电位较正, PANI 的  $E_F$  下移, 有利于  $Fe(CN)^{3-}$  捕捉光生空穴, 从而有利于产生阳极光电流.

#### 3 结 论

PANI 膜在 K<sub>3</sub>Fe(CN) 6/K<sub>4</sub>Fe(CN) 6 溶液中的循环伏安图表明三种氧化还原态 PANI 中只有部分 氧化态 PANI 具有良好的电子传输性能. 从部分氧化态 PANI 的光电流谱得到的 Fow ler 图表明 PANI 膜具有内光电发射效应. 从 Fow ler 图求得的绝缘母体的禁带宽度为 3.33 eV,并证实了该绝缘母体还 原态 PANI 是一种宽禁带的 p 型半导体. 从 M ott-Schottky 图得到部分氧化态和还原态 PANI 在 1.0 mol/L HClO<sub>4</sub> 溶液(pH= 0.43) 的平带电位都为 0.63 V(vs. SCE). 进一步证明部分氧化态 PANI 中的 母体为还原态 PANI. 提出了内光电发射的光电化学模型来解释部分氧化态 PANI 的光电化学过程及 相应能带结构.

#### 参考文献

- 1 Boudreaux D. S., Chance R. R., Wolf J. F. et al. J. Chem. Phys. [J], 1986, 85: 4 584-4 590
- 2 Stafstrom S., Bredas J. L., Epstein A. J. et al. Phys. Rev. Lett. [J], 1987, 59: 1 464-1 467
- 3 Roe M. G., Ginder J. M., Wigen P. E. et al. Phys. Rev. Lett. [J], 1988, 60: 2789-2792
- 4 Dos Santos M. C., Bredas J. L., Phys. Rev. Lett. [J], 1989, 62: 2 499-2 502
- 5 McCall R. P., Grinder J. M., Leng J. M. et al. Phys. Rev. B[J], 1990, 41: 5 202-5 213
- 6 Epstein A. J., Ginder J. M., Zuo F. et al. Synth. Met. [J], 1987, 18: 303-309
- 7 Ginder J. M., Richter A. F., MacDiarmid A. G. et al. Solid State Commun. [J], 1987, 63, 97-102
- 8 Zuo F., Angelopoulos M., MacDiarmid A. G. et al. Phys. Rev. B[J], 1987, 36: 3 475-3 478
- 9 Jozefowicz M. E., Laversanne R., Javadi H. H. S. et al. Phys. Rev. B[J], 1989, 39: 12958-12961
- 10 MacDiarmid A. G., Epstein A. J., Faraday Discuss. Chem. Soc. [J], 1989, 88: 317-332
- 11 Javadi H. H. S., Zuo F., Cromack K. R. et al. Synth. Met. [J], 1989, 29: 409-416
- 12 Paul E. W., Ricco A. J., Wrighton M. S.. J. Phys. Chem. [J], 1985, 89: 1441-1447
- 13 McManus P. M., Yang S. C., Cushman R. J., J. Chem. Soc., Chem. Commun. [J], 1985: 1 556-1 561
- 14 McManus P. M., Cushman R. J., Yang S. C., J. Phys. Chem. [J], 1987, 91: 744-747
- 15 Genies E. M., Boyle A., Lapkowski M. et al.. Synth. Met. [J], 1990, 36: 139-182
- 16 Desilvestro J., Haas O., Electrochim. Acta[J], 1991, 36: 361-367
- 17 Kalaji M., Nyholm L., Peter L. M. et al. J. Electroanal. Chem. [J], 1991, 310: 113-126
- 18 Li Z., Dong S.. Electrochim. Acta[J], 1992, 37(6): 1 003-1 006
- 19 Kilmartin P. A., Wright G. A.. Electrochim. Acta[J], 1996, 41(10): 1677-1687
- 20 Neves S. Das, Da Fonseca C. N. P., De Paoli M. A.. Synth. Met. [J], 1997, 89: 167-169
- 21 Kilmartin P. A., Wright G. A.. Electrochim. Acta[J], 1998, 43(21/22): 3 091-3 103
- 22 Maia D. J., Neves S. Das, Alves O. L. et al. Electrochim. Acta[J], 1999, 44: 1 945-F952

- 23 Watanabe T., Gerischer H., J. Electroanal. Chem. [J], 1981, 122: 73-84
- 24 Sukamto J. P. H., Mcmillan C. S., Smyrl W. H.. Elactrochim. Acta[J], 1993, 38: 15-27
- 25 Castillo L. M., Peter L. M.. J. Electroanal. Chem.[J], 1983, 146: 377-384
- 26 Helman J. S., Sanchez-Sinencio F., Phys. Rev. B[J], 1973, 7: 3 702-3 709
- 27 ZHANG Hong-Ping(张红平), LUO-Jin(罗 瑾), HUANG Huai-Guo(黄怀国) et al.. Chem. J. Chinese Universities(高等学校化 学学报)[J], 1999, 20(4): 624—628
- 28 LUO-Jin, LIN Zhong-Hua, WU Ling-Ling et al. Chem. R. Chinese Universities [J], 1996, 12(3): 270-279
- 29 Bard A. J., Faulkner L. R. Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications[M], New York: Wiley, 1980: 636
- 30 HUANG Huai-Guo(黄怀国), LUO-Jin(罗 瑾), ZHANG Hong-Ping(张红平) et al. Chem. J. Chinese Universities(高等学校化学学报)[J], 2000, 21(2): 283-285
- 31 Fujishima A. Electrochemical Mensuration [M], Beijing: Peking University 🕲 Printing House, 1994: 365

## Internal Photoemission in Polyaniline

HUANG Huai-Guo<sup>1</sup>, LUO Jin<sup>2</sup>, ZHANG Hong-Ping<sup>2</sup>, WU Ling-Ling<sup>2</sup>, LIN Zhong-Hua<sup>2\*</sup>

(1. Xiamen Zij in Science and Technology Co. Ltd., Fuj ian Zij in Research Institute of Mining and Matallurgy,

Fujian Zijin Mining Industry Co. Ltd., Shanghand 364200, China;

2. State Key Laboratory for Physical Chemistry of the Solid Surface, Department of Chemistry, Institute of Physical Chemistry, Xiamen University, Xiamen 361005, China)

Abstract After self-assembling a *p*-aminothiophenol(PATP) monolayer on bare Au electrode, polyaniline

(PANI) films were prepared by electropolymerization on the modified Au electrode and three forms of PANI (reduced PANI, partially-oxidized PANI and oxidized PANI) were obtained by electrochemical method. The SEM pattern shows that there are some hills of PANI on a compact layer of PANI. The cyclic votammograms of the probe[K<sub>3</sub>Fe(CN)  $\epsilon$ /K<sub>4</sub>Fe(CN)  $\epsilon$ ] for the three forms of PANI film show that partially-oxidized PANI has a good electron transport performance. The potential dependence of magnitude and spectra of the photocurrent of PANI films were observed. The bandgap energy of 1. 45 eV for oxidized PANI, which is the threshold energy of its photocurrent spectra, was obtained. The spectra of photocurrent spectra and follows Fowler rule(IPCE<sup>1/2</sup> ~ hv). The bandgap energy of insulating matrix in partially-oxidized PANI is determined as 3. 33 eV by the Flowler plots, and the insulating matrix in partially-oxidized PANI is verified to be reduced PANI. The flat-band potential, in the order of 0. 63 V vs. SCE, is obtained from Mott-Schottky plots. A photoelectrochemical process based on internal photoemission in partially-oxidized PANI, which agrees with the model of granular metal island that assumes metallic polymer particles are embedded in the insulating matrix, is proposed.

Keywords Polyaniline; Photoelectrochemistry; Internal photoemission

(Ed.: F, X)